(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-57396

(P2002-57396A)

(43)公開日 平成14年2月22日(2002.2.22)

| (51) Int.Cl.7 | 0 1 S 3/17 3/06 3/10 | 5 F O 7 2 B Z |
|---------------|----------------------------|---------------------|
|---------------|----------------------------|---------------------|

泰本譜水 未譜水 請水項の数25 OL (全 8 頁)

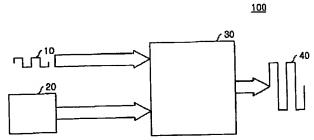
| | | 番食酮冰 | 木崩水 前水項の数23 〇七 (至 6 以) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| (21)出願番号 | 特顧2000-399523(P2000-399523) | (71) 出願人 | 596180076 韓國電子通信研究院 |
| (22)出顧日 | 平成12年12月27日 (2000. 12. 27) | | Electronics and Telecommunications Res |
| (31)優先権主張番号 (32)優先日 (33)優先権主張国 | 2000-44233 平成12年7月31日(2000.7.31) | | earch Institute 大韓民国大田廣城市儒城區柯亭洞161 |
| | 韓国(KR) | (72)発明者 | チェ ヨンキュ 大韓民国 デジョンシ ユショング シン ソンドン ハナ アパートメント. 110 |
| | | (- 1) (D) | -409 |
| | | (74)代理人 | 100077481 弁理士 谷 義一 (外2名) |
| | | | 最終頁に続く |

(54) 【発明の名称】 光増幅器および光利得媒質

(57)【要約】

【課題】 1600~1650nm波長帯域の増幅器に適用できる 光増幅システムを提供する。

【解決手段】 光信号を増幅するための光増幅器におい て、光信号に対する利得媒質に使用するために、プラセ オジム (Pr^{3+}) イオンが添加された低ホノンエネルギー 光学媒質と、1600~1700mm帯域内の増幅された光信号を 得るために、低ホノンエネルギー光学媒質を励起させる ための励起手段とを備えた。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光信号に対する利得媒質として使用するためにプラセオジム (Pr³+) イオンが添加された低ホノンエネルギー光学媒質と、

1

該低ホノンエネルギー光学媒質を励起させ、1600~1700 nm帯域内の増幅された光信号を得る励起手段とを備えた ことを特徴とする光信号を増幅するための光増幅器。

【請求項2】 前記低ホノンエネルギー光学媒質は、代表的なホノンエネルギー値が320cm⁻¹以下であることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。

【請求項3】 前記低ホノンエネルギー光学媒質は、セレニドガラスであることを特徴とする請求項1に記載の 光増幅器。

【請求項4】 前記セレニドガラスは、プラセオジムイオンの溶解度を向上させるためにガリウムイオン(G a³⁺)を含むことを特徴とする請求項3に記載の光増幅 器。

【請求項5】 前記低ホノンエネルギー光学媒質は、テルル系ガラスであることを特徴とする請求項1に記載の 光増幅器。

【請求項6】 前記低ホノンエネルギー光学媒質は、単結晶形態であることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。

【請求項7】 前記低ホノンエネルギー光学媒質は、非晶質形態であることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。

【請求項8】 前記プラセオジムイオンの量は、0.1モル%以下であることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。

【請求項9】 エルビウムイオン (Er³⁺) が感光剤として前記低ホノンエネルギー光学媒質に添加されることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。

【請求項10】 前記エルビウムイオンの添加量は、1 モル%以下であることを特徴とする請求項9に記載の光 増幅器。

【請求項11】 前記励起手段は、1450~1500mmまたは 1900~2100mm波長帯域を有する励起光源を発生させることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。

【請求項12】 前記励起手段における励起準位は、 Pr^{3+} : $(^3F_3$ 、 3F_4) または Pr^{3+} : $(^3F_2$ 、 3H_6) であることを特徴とする請求項11に記載の光増幅器。

【請求項13】 前記プラセオジムイオンと前記エルビウムイオンとが互いにエネルギー共鳴状態であることを特徴とする請求項9に記載の光増幅器。

【請求項14】 前記低ホノンエネルギー光学媒質は、 光ファイバの形態であることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。

【請求項15】 前記低ホノンエネルギー光学媒質は、 平板導波路の形態であることを特徴とする請求項1に記 載の光増幅器。 【請求項16】 低ホノンエネルギー物質と、

前記低ホノンエネルギー物質に添加されるプラセオジム イオンとを備えたことを特徴とする光利得媒質。

【請求項17】 前記低ホノンエネルギー物質は、低ホノンエネルギーガラスであることを特徴とする請求項16に記載の光利得媒質。

【請求項18】 前記低ホノンエネルギー物質は、代表的なホノンエネルギー値が $320 \,\mathrm{cm}^{-1}$ 以下であることを特徴とする請求項16に記載の光利得媒質。

10 【請求項19】 前記プラセオジムイオンの量は、0.1 モル%以下であることを特徴とする請求項16に記載の 光利得媒質。

【請求項20】 エルビウムイオンが感光剤として前記低ホノンエネルギー光学媒質に添加されることを特徴とする請求項16に記載の光利得媒質。

【請求項21】 前記エルビウムイオンの添加量は、1 モル%以下であることを特徴とする請求項20に記載の 光利得媒質。

【請求項22】 前記低ホノンエネルギー物質は、非晶 20 質形態であることを特徴とする請求項16に記載の光利 得媒質。

【請求項23】 前記低ホノンエネルギー物質は、セレニドガラスであることを特徴とする請求項16に記載の 光利得媒質。

【請求項24】 前記セレニドガラスは、プラセオジムイオンの溶解度を向上させるためにガリウムイオンを含むことを特徴とする請求項23に記載の光利得媒質。

【請求項25】 前記低ホノンエネルギー物質は、テルル系ガラスであることを特徴とする請求項16に記載の30 光利得媒質。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光増幅器および光利得媒質に関し、より詳細には、光波長が1600~1650nm 帯域の信号光を増幅するための光増幅器および光利得媒質に関する。

[0002]

【従来の技術】周知のように、光通信における伝送容量の画期的な向上のために導入された波長分割多重伝送において、チャネルの間隔を小さくすることは、非線型効果によって伝送品質を低下させることとなる。したがって、伝送容量を大きくするためには、信号光の波長範囲を広くすることが好ましい。通常、光伝送に用いられるシリカ光ファイバの低損失波長領域は、およそ1200~1700mである。したがって、約500mに達する広い波長帯域を、実際の光伝送に用いることが可能である。ゆえに、この広い波長帯域で動作可能な光増幅器の開発は、非常に重要なことである。

[0003]

50 【発明が解決しようとする課題】光伝送用のシリカ光フ

ァイバの低損失波長領域である1200~1700nmの範囲を全て活用するために、現在、1300nm帯域、1450nm帯域、1530~1600nm帯域、及び1650~1680nm帯域のいずれかで動作するイオン添加光ファイバ増幅器の研究が進められている。しかしながら、1600~1650nm波長帯域に用いられる光増幅器は、現在のところ開発されていない。

【0004】特に、エルビウム(Er)添加シリカ光ファイバ増幅器の利得帯域は、約1600mmより短い波長に限られる。これは、エルビウムイオンの4f-4f間の遷移特性に起因するものであり、従来の技術では、1600~16 1050mm帯域で動作するイオン添加光増幅器は皆無である。

【0005】また、ツリウムを添加したフッ化物系光ファイバ増幅器の場合には、利得波長帯域が1650nmより長い。これは、同様にツリウムイオンの遷移特性に起因するものであり、利得帯域を1650nmより短くすることは非常に難しい。

【0006】本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、1600~1650nmの波長帯域の増幅器に適用できる光増幅器および光利得媒質を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、このような目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、光信号に対する利得媒質として使用するためにプラセオジム(Pr³+)イオンが添加された低ホノンエネルギー光学媒質と、該低ホノンエネルギー光学媒質を励起させ、1600~1700nm帯域内の増幅された光信号を得る励起手段とを備えたことを特徴とする。

【0008】請求項16に記載の発明は、低ホノンエネルギー物質と、前記低ホノンエネルギー物質に添加され 30 るプラセオジムイオンとを備えたことを特徴とする。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明 の実施形態について詳細に説明する。

【0010】図1は、本発明の一実施形態にかかる光増幅器を示した概略図である。光増幅器100は、入力光信号10と励起ソース20を入力とし、増幅された光信号40を出力するプラセオジム(Pr³+)イオンのような希土類イオンが添加された低ホノンエネルギーガラス30で構成されている。

【0011】このような光増幅器100において、一定 波長の光信号10が、低ホノンエネルギーガラス30に 入力され、励起ソース20で発生した励起光が低ホノン エネルギーガラス30内のプラセオジムのような希土類 イオンを励起させることによって、増幅された光信号40が得られる。

【0012】上述した光増幅器100に用いられる光ガラスは、 1.6μ m帯域のプラセオジムイオンの蛍光を使用するためには、ホスト材料の代表的なホノンエネルギーが約320 cm^{-1} より小さいものが求められる。

【0013】エルビウム添加シリカ光ファイバ増幅器の場合のように、一般的な光ファイバ増幅器及び平板導波路増幅器は、目的とする波長帯域で蛍光遷移を発生させるために、光ポンピングされた状態で上述した波長帯域の信号光が入射されると、誘導放出現象によって信号光の強さが大きくなる。この場合、信号光の利得に影響を及ぼす因子は、極めて多様であって、基本的に、特定波長で効果的な光増幅を達成するためには、(1)蛍光遷移の波長範囲が信号光の波長帯域にあり、(2)蛍光遷移の誘導放出断面積が大きく、(3)蛍光遷移の転移分配率が大きく、(4)蛍光寿命が長く、(5)ホスト材料が光ファイバ形態や平板導波路形態に容易に成形でき、(6)ホスト材料が熱的、機械的に安定すべきであ

【0014】プラセオジムイオンの4f-4F遷移の一 つである (³F₃、³F₄) → ⁶H₄ 遷移の中心波長は、約1650n mである。しかし、一般的な光ガラスでは、遷移強度が 非常に弱く、測定される蛍光寿命も非常に短い。これ は、3F3準位と最近接下位準位である3F2準位とのエネル ギー間隔が、約1350cm-1と小さいので、多重ホノン緩和 (multi-phonon relaxation) 現象が極めて大きく発生 して、蛍光寿命を短くするためである。多重ホノン緩和 率の大きさは、ホスト材料の振動エネルギーに対して指 数的に比例する。ここで、(3F_3 、 3F_4) 準位の蛍光か ら、実験的に測定された多重ホノン緩和率の大きさを最 もよく説明するホノンエネルギーとして、代表的な振動 エネルギーに言及する。すなわち、ホスト材料の振動工 ネルギーが大きいほど、多重ホノン緩和率も大きくなる のである。一般的に、ガラスの網の目(network)を構 成するガラス形成イオンと関連した振動モードが、主に 希土類イオンの多重ホノン緩和率に大きい影響を及ぼ す。例えば、シリカガラスでSi-O結合の振動エネルギー は、約1100cm $^{-1}$ であるため、プラセオジムイオンの1.6и m遷移は、シリカガラスで事実上不可能となるのであ

【0015】したがって、プラセオジムイオンから発生する1.6μm蛍光の強度を向上させるためには、ホノンエネルギーが小さいガラスを、ホスト材料に使用することが要求される。従来の光増幅器に用いられるホスト材料には、アルミノシリケート(alumino-silicate)、酸化テルル系ガラス(tellurite)、重金属フッ化物系ガラス、硫化物系ガラスなどがあり、各々のホノンエネルギーは、各々1100cm⁻¹、700cm⁻¹、500cm⁻¹、350cm⁻¹である。

【0016】上述したフッ化物系ガラス、硫化物系ガラス及びセレニド(selenide)ガラスの遷移特性は、表1にさらに詳細に説明されている。すなわち、フッ化物系及び硫化物系ガラスでの 1.3μ m蛍光遷移 $Pr^{3+}:^1G_4 \rightarrow ^3H_5$ と、本発明のホスト材料に用いられたセレニドガラスでの 1.6μ m蛍光遷移(3F_3 、 $^3F_4) <math>\rightarrow ^3H_4$ との特性値を示

す。ここで、表 1 に示したフッ化物系ガラスと硫化物系ガラスの特性値は、D. R. Simons et al.、" Pr^{3+} -Doped GeSx-Based Glasses for Fiber Amplifiers at $1.3\,\mu$ m" Opt. Lett.、vol. 20、 no. 5、 pp. 468-470 (1995)、及び D. W. Hewark et al.、"Quantum-Efficiency of Praseody mium Doped Ga:La:S Glass for $1.3\,\mu$ m Optical Fiber Amplifiers"、 IEEE Photon. Technol. Lett.、 vol. 6、 no. 5、 pp. 609-612 (1994) の先行論文に掲載された内容である。

5

【0017】 (3F_3 、 3F_4) 準位の固有の輻射寿命は、密度分布を考慮して測定されるが、測定された寿命と放出断面積とをかけた値は、光ファイバ増幅器の効率を決定する重要な要素となる。表1に示したように、セレニド

ガラスから測定される寿命と放出断面積の大きさとは、硫化物系ガラスのそれより大きい。そして、 $\Pr^{3+:3}H_4 \rightarrow ^1G_4$ 遷移の振動強度 (oscillator strength) は、 $\Pr^{3+:3}H_4 \rightarrow ^1G_4$ 遷移の振動強度 (oscillator strength) は、 $\Pr^{3+:3}H_4 \rightarrow ^1G_4$ 遷移と比較すると、それほど大きくはなく、 1.3μ mの蛍光放出は、約1020nm帯域で発生する。また、この被長帯域で使用可能な高電力レーザーダイオードが商業的には開発されていないが、1480nm被長帯域では、使用可能な強くて安定的なレーザーダイオードが開発されており、 1.6μ m放出用励起ソースとして效果的に利用することができる。これに対する詳細な説明は後述する。

[0018]

【表1】

| ガラス | 遷移 | I | た蛍光寿 | 測定され た蛍光寿 命(μe) | 遷移 分配率 (%) | 量子効率 (%) | 放出断面積と 測定された蛍 光寿命の積 (10 ⁻²⁶ cm ² s) |
|-----------|-----------|------|---------|-----------------------|------------------|-------------|--|
| フッ化物 系 | ¹G₄→⁵H | ~500 | 2484 | 110 | 60 | 4 | 36 |
| 硫化物系 | ¹G₄→³H | ~350 | 510 | 300 | 52 | 60 | 250 |
| セレニド | (3F. 3F.) | ~200 | ~ 320 ± | 212±10 | 77 | 65±20 | 636±200 |

【0019】また、プラセオジムイオンの 3F_3 準位と 3F_2 **準位とのエネルギー間隔が小さいので、硫化物系ガラス** を使用しても1.6μπ蛍光の蛍光寿命が非常に短くなる。 したがって、1.6μπ帯域増幅器としてプラセオジム添加 ガラス素材を利用するためには、ホストガラスの代表的 なホノンエネルギーが約320cm⁻¹より小さくすべきであ る。この条件を満足するようなガラス系の中では、セレ ニドガラスとテルル系ガラスとが最も好適である。これ らのガラスが有する優れたガラス形成能力のためであ る。セルレナイドガラスは、主なガラス形成イオンがセ レニウム (selenium) であって、Ge-As-Se、Ge-Sb-Se、 As-Seなどがある。そしてテルル系ガラスは、テルル(t ellurium) が主なガラス形成イオンであって、Ge-Se-T e、Ge-As-Se-Teなどがある。またGe-S-I、Ge-Ga-S-Brな どのような低ホノンエネルギーガラスもホスト材料とし て適用可能である。結論的に、プラセオジムイオンの1. 6μm蛍光を利用するためには、ホスト材料の代表的なホ ノンエネルギーが320cm⁻¹より小さいものが求められ る。

【0020】(実施例1)第1の発明の実施例では、Ge-As-Se系列のガラスに対していくつかの組別に実験及び分析して、Ge30As6Ga2Se60の組成を有するガラスをホスト材料に使用した。まず、プラセオジムイオンの溶解度を調べた結果、1モル%のプラセオジムイオンが添加されても良好なガラス状を形成した。すなわち、Ge-As-Seの3つの成分系のガラスに少量のGaを添加することによって、希土類イオンの溶解度を向上させたものである。

【0021】上述したガラス製造について、より詳しく 説明すれば、まず純度99.999%以上のGe、Ga、As及びSe 粉末を準備し、希土類ソースには、純度99.999%以上の 純度を有するプラセオジムとエルビウム金属とを準備す る。ここで、1モル%まではプラセオジムがホスト内に溶 解されるが、少ない量のガリウム(Ga)をGe-As-Se系に 添加することによって、溶解度をさらに向上させること ができる。各々の物質を計量し、シリカ容器に仕込んだ 後、シリカ容器を密閉して炉(rocking furnace)内で 溶融させる。温度は、最初は、2℃/minで500℃まで次第 に昇温させた後、1000℃までは1℃/minで徐々に昇温さ せる。1000℃で12時間の間溶融させた後、溶融液が入っ た容器を炉から取り出して水で急冷させる。次いで、試 料をガラス遷移温度(約360℃)近くで焼きなましさせ た後、測定のために、2mm厚さに薄く切り取った後、艶 出しして(polishing)完成する。

【0022】また、本発明に用いられるセレニドガラスは、優れた熱的安定性を示す。すなわち、転移温度と晶化温度とは、各々約350℃と510℃とで、ガラス棒から光ファイバを延伸することが容易である。実際に、Ge-As-Ga-Se系の相異なる組成を有するガラス棒の延伸工程は、既に実験されたことがあり、このように延伸された光ファイバは、光学性質及び機械的性質に優れた面を示している。

【0023】図2は、1モル%のPrイオンが添加された セレニドガラスの吸収スペクトルを示した図である。ホ 50 ストガラスの短波長側の吸収が、約800nmから始まるこ とが分かる。したがって、約800nmより短い波長でプラセオジムイオンを励起することは、励起光の一部がホスト材料に吸収されるために、励起効率を低下させることになるだけでなく、ホスト材料の変形を引き起こすこととなる。実際に、800nmで、150nW強度でレーザービームを約10分間試片に照射した結果、試片の温度が急激に上昇し、レーザービームが照射された部分の局部的な溶融現象が発見された。

7

【0024】図3は、プラセオジムイオン (Pr³+) 及び エルビウムイオン (Er³⁺) のエネルギー準位を示した図 である。 3F_3 と 3F_4 準位及び 3F_2 と 3H_6 準位の各々の間隔が 狭い方ので、各エネルギー準位の差に応じたボルツマン 分布 (Boltzmann distribution) を計算すれば、各々の 上位準位である 3 F4と 3 F2からの密度は、各々10%と 9 %程 度である。したがって、³F₃ー³F₄及び³F₂ー³H₆準位は、 各々 (³F₃、³F₄) マニホルド (manifold) 及び (³F₂、³ H_6) マニホルドと見るのが妥当である。(3F_3 、 3F_4)準 位の吸収断面積の最大値は、1590nmでは2.1×10⁻²⁰cm² であり、1480nmでは1.2×10⁻²⁰cm²であり、一般的な酸 化物ガラスでさらに大きい値を示す。一方、各吸収遷移 の振動強度を利用してJudd-Ofelt分析を実施してみれ ば、最適化されたJudd-Ofelt強度因子 (intensity para meter) Ω_1 、 Ω_2 及び Ω_3 は、各々 1.01×10^{-20} cm 2 、10.54×10⁻²⁰cm²及び2.53×10⁻²⁰cm²である。ここで、Judd-Ofelt 分析時の典型的な誤差は、約15%程度である。

【0025】図4は、0.05モル%Pr³+添加セレニドガラスの蛍光放出スペクトルを示した図である。一般的にエルビウム添加光ファイバ増幅器に用いられる1480nmレーザーダイオードを利用して、光ポンピングして得られた蛍光放出スペクトルが示されている。本実施例で使用したホスト組成から観察された1.6μm帯域の蛍光のピーク波長は、約1650nm半波高全幅値(full width at half maximum)は、約100nmであった。もちろん、ピーク波長は、サンプル組成に応じて多少変わる。

【0026】図5は、セルレナイドガラス内のPr³⁺添加 濃度に対する(3F_3 、 3F_4)準位の蛍光寿命を示した図で ある。図5において、1.6μm帯域蛍光の蛍光寿命は、プ ラセオジムイオンの濃度が0.05モル%までは、215±5μ s でほとんど一定であり、それ以上の濃度では減少し た。Judd-Ofelt分析から計算された輻射遷移確率(radi ative transition probability)と比較して計算した量 ⁻子効率は、65±20%であった。量子効率を計算するとき に発生した誤差の大部分は、Judd-Ofelt分析時に発生し たものと判断される。また、誘導放出断面積を計算した 結果、最大値が $(3\pm1) imes 10^{-20}$ cm 2 で極めて大きい値を示 した。 $(^3F_3, ^3F_4) \rightarrow ^3H_4$ 遷移の転移分配率は、約77%に 計算され、したがって該当準位から発生する輻射遷移の 大部分は、1.6μm蛍光に集中することが分かる。一方、 希土類イオンの濃度が増加しながら発生する蛍光寿命の 減少を濃度消光(concentration quenching)といい、

このような蛍光寿命の滅少は、プラセオジムイオン間の非輻射エネルギー伝達に起因する。具体的に、次のような2つのスキームが存在する。すなわち、第1に、 $(^3F_3$ 、 3F_4): $^3H_5 \rightarrow (^3F_2$ 、 3H_6): $(^3F_2$ 、 3H_6) $):^3H_5$ がある。このようなイオン間の非輻射エネルギー伝達を最小化するために、本実施例のホスト組成では、プラセオジムイオンの添加量は、最大0.05モル%が好適であることが分かるし、種々の条件に応じてプラセオジムイオンの添加量は、0.1モル%以下が好ましい。

【0027】プラセオジムイオンから発生する 1.6μ m帯域の蛍光を得るための励起波長には、直接励起(direct pumping)、すなわち 3 H $_4$ \rightarrow (3 F $_3$, 3 F $_4$)吸収遷移が表われる波長帯域のうち、短い波長側を使用するのが好ましい。具体的に、既存のエルビウム添加シリカ光ファイバ増幅器を励起する時に用いられる1480nmレーザーダイオードを、そのまま使用することができるという長所がある。もう一つの励起方法としては、 3 H $_4$ \rightarrow (3 F $_2$, 3 H $_6$)吸収パンドを利用することである。すなわち、約2000nmに該当する波長で励起する場合、(3 F $_2$, 3 H $_6$):(3 F $_3$, 3 F $_4$): 3 H $_5$ に該当するエネルギー伝達が発生し、結果的に密度反転(population inversion)を得られることとなる。

【0028】 (実施例2) 第2の実施例として、1480nm 帯域の励起効率を向上させるためのイオン共同添加スキ ーム (codoping scheme) について説明する。第2の実 施例では、既存の1480nmレーザーダイオードをそのまま 使用する場合に対して、1.6μπ帯域蛍光の強度及び見か け蛍光寿命 (apparent lifetime) の向上を図った。上 述したように、1480nm帯域は、現在エルビウム添加増幅 器の励起波長に用いられている。したがって、プラセオ ジムイオンとエルビウムイオンとを共に添加したセレニ ドガラスを製造した。具体的には、プラセオジムイオン の添加量は、0.05モル%に固定し、エルビウムの添加量 を多様に変化させたサンプルを製造した。このようなガ ラスに、1480nmレーザーダイオードを使用して励起する 揚合、プラセオジムイオンとエルビウムイオンとが同時 に励起される。この場合、各イオンが励起される比率 は、該当波長における吸収断面積及び添加濃度に比例す ることとなる。上述したように、1480nmで、プラセオジ ムイオンの吸収断面積は、1.2×10⁻²⁰cm²であり、エル ビウムの吸収断面積を測定した結果、1.1×10⁻²⁰cm²で あった。したがって、同じ濃度で二つのイオンが添加さ れたガラスを励起する場合、プラセオジムイオンの励起 率 (excitation ratio) がエルビウムイオンのそれより 大きくなる。プラセオジムイオンの1.6μmにおける蛍光 強さを向上させるためには、エルビウムイオンの $^4\mathrm{I}_{13/2}$ 準位に存在する密度が、プラセオジムイオンの(³F_{3、}3 F4) 準位に効率的に移動すべきである。この場合、この ようなエネルギー伝達は、2つの形態で発生し得る。第 1は、輻射エネルギー伝達(radiative energy transfer)であり、第2は、非輻射エネルギー伝達(nonradiative energy transfer)である。このような二つの形態において、これらエネルギー伝達を励起するために、できるだけドナーの放出スペクトルとアクセプタの吸収スペクトルとが重ねられる。すなわち、エネルギー共鳴

9

ペクトルとが重ねられる。すなわち、エネルギー共鳴 (energy resonance) が大きいほどエネルギー伝達が活 発に発生するのである。第2の実施例のように、プラセ オジムイオンとエルビウムイオンとを共に添加すれば、 約1536nmにピークがある典型的なエルビウムイオンの 4 I 13/2→4I15/2遷移に起因する蛍光が、エルビウムイオン かち発生する。このような蛍光の波長は、プラセオジム イオンの (3F_3 、 3F_4) 吸収帯と非常によく一致する。そ れに対し、プラセオジムイオンの放出スペクトルとエル ビウムイオンの吸収スペクトルとは、重なる部分が反対 の場合より極めて小さい。一方、エネルギー伝達の大き さを決定するもう一つの因子は、エネルギードナーイオ ンの輻射遷移確率と非輻射遷移率が小さく、測定される **蛍光寿命が長いことである。第2の実施例で使用したセ** レニド組成のガラスでエルビウムイオンを単独添加した 場合、エルビウムイオンの⁴I_{13/2}準位の蛍光寿命は、3. 26msとして、プラセオジムイオンの(3F_3 、 3F_4)準位の 蛍光寿命より極めて長いということを確認した。結局、 二つのイオンを共に添加して1480nm帯域に励起する場 合、エルビウムイオンからプラセオジムイオンに活発な エネルギー伝達が発生することが分かり、反対に、プラ セオジムイオンからエルビウムイオンへのエネルギー伝 達は、これに比べて発生し難いであろうとのことが理論 的に分かる。一方、エルビウムイオンからプラセオジム イオンへのエネルギー伝達は、輻射エネルギー伝達より 非輻射エネルギー伝達が優れている。これは、ドナーと アクセプターとの間の距離が小さくなるほど非輻射エネ ルギー伝達の大きさが輻射エネルギー伝達の大きさより 非常に大きくなり、したがって、共に添加された組成物 では、一般的に非輻射エネルギー伝達が優れることとな る。

【0029】図6は、0.05モル $%Pr^{3+}$ と0.2モル $%Er^{3+}$ とが共に添加されたガラスの蛍光放出スペクトルを示した図である。エルビウムイオンからプラセオジムイオンへのエネルギー伝達が活発に発生することを示す端的な例として、プラセオジムイオンが単独に添加されたサンプルとエルビウムイオンと共に添加されたサンプルから発生する 1.6μ m帯域蛍光強度が、エルビウムイオンが添加された場合にさらに向上することを確認し得るし、同時に 1.5μ m帯域でエルビウムイオンから発生する。重要なことは、エルビウムイオンの番光が表われる。重要なことは、エルビウムイオンのが、エルビウムイオンの 1.5μ m帯域蛍光の強度は、プラセオジムイオンの 1.5μ m帯域蛍光に比べて非常に小さいとい

うことである。これは、エネルギー伝達が非常に活発に 発生することを示す例である。一方、非輻射エネルギー 伝達が発生すれば、ドナーの蛍光寿命は、減少し、アク セプターの蛍光寿命は増加することとなる。

【0030】図7は、0.05モル%Pr³⁺単独添加ガラス及 び0.05モル%Pr³+/0.5モル%Er³+が共に添加されたガラス の蛍光減衰曲線を示した図である。プラセオジムイオン の1.6 µ m帯域蛍光の存続時間の増加を示す代表的な例で ある。ここで、プラセオジムイオン0.05モル%とエルビ ウムイオン0.5モル%とを共に添加した場合は、プラセオ ジム0.05モル%を単独に添加した場合より、二倍程度の 存続時間の増加があることが分かる。これもまた二つの イオン間のエネルギー伝達が活発に進行していることを 示す。エルビウムイオンの蛍光寿命がプラセオジムイオ ンの蛍光寿命より長いため、プラセオジムイオンの蛍光 寿命は、プラセオジムとエルビウムイオンとが共に添加 された場合より長くなる。すなわち、励起光が消えても 特続的に長い時間にわたってエルビウムイオンからプラ セオジムイオンにポピュレーション (population) が供 給されるために、プラセオジムイオンの蛍光寿命が長く なるのである。

【0031】図8は、Er³⁺添加量によるPr³⁺:1.65μm蛍 光とEr³⁺:1.54μm蛍光の蛍光寿命を示した図である。0. 1モル%のエルビウムが添加されたガラスを例に挙げれ ば、単独添加の場合、蛍光寿命が3.26msでプラセオジム イオンが0.05モル%導入されれば、約0.75msに急激に減 少することが分かる。ここで、プラセオジムイオン濃度 が0.05モル%に固定されていても、エルビウムイオンの 濃度が増加するにつれて、蛍光寿命は次第に減少するこ とが分かる。結論的に、プラセオジムイオンとエルビウ ムイオンとを共に添加すれば、1480nm帯域の励起効率が 急激に向上するのである。これは、プラセオジムイオン を多量添加することが好ましくない状況で、1.6μ т帯域 蛍光の強度を向上させる極めて効率的な手段である。た だし、エルビウムイオンの最大添加量は、ホスト材料の 希土類イオンに対する溶解度と、エルビウムイオンから 発生する1.6μπ帯域での基底状態吸収(ground state a bsorption)とによって決定することができるし、好ま しくは、1モル%以下が好ましい。一方、プラセオジムイ オンとエルビウムイオンとが共に添加された場合におい て、励起波長として1.5μπ帯域光ファイバレーザーのよ うな光源を使用しても、上記1480nmレーザーダイオード を使用した場合と同様の効果を示す。

【0032】(実施例3)第3の実施例として、プラセオジムイオンを対象にセレニド系列ガラスの溶解度を向上させるために実施された一連の実験結果、熱的安定性に優れて光ファイバ製造が容易なGe-As-Seの三つの成分系に少量のガリウムを添加すれば、溶解度が向上することを確認した。

【0033】本発明の技術思想は、上述した好ましい実

12

施例によって具体的に記述されたが、上述した実施例は その説明のためのものであって、その制限のためのもの ではないことに留意されるべきである。また、本発明の 技術分野における通常の専門家であるならば、本発明の 技術思想の範囲内で種々の実施例が可能であることを理 解されるべきである。

[0034]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、プラセオジムイオンが、代表的なホノンエネルギーが約320cm⁻¹より小さいガラスに添加された場合に、1.6μm 帯域の蛍光放出を利用するレーザー及び増幅器に用いることができる。励起波長は、既存の1480nmレーザーダイオードを使用し得るし、または、1550nm帯域のエルピウム添加光ファイバレーザーを使用することもできる。またプラセオジムとエルビウムイオンとを共に添加したガラスで、エルビウムイオンからプラセオジムイオンへのエネルギー伝達が非常に效率的に発生して1.6μm蛍光の励起効率が向上される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態にかかる光増幅器を示した 20 概略図である。

【図2】1モル%のPrイオンが添加されたセレニドガラスの吸収スペクトルを示した図である。

【図3】プラセオジムイオン及びエルビウムイオンのエネルギー準位を示した図である。

【図4】0.05モル $%Pr^{3+}$ 添加セレニドガラスの蛍光放出スペクトルを示した図である。

【図 5 】 セルレナイドガラス内の \Pr^{3+} 添加濃度に対する $\binom{3}{F_3}$ 、 $\binom{3}{F_4}$) 準位の蛍光寿命を示した図である。

【図 6 】 0.05 モル% Pr $^{3+}$ と0.2 モル% Er $^{3+}$ とが共に添加さ 10 れたガラスの蛍光放出スペクトルを示した図である。

【図7】0.05モル $^{3+}$ 単独添加ガラス及び0.05モル $^{3+}$ /0.5モル $^{3+}$ が共に添加されたガラスの蛍光減衰曲線を示した図である。

【図8】 Er^{3+} 添加量による Pr^{3+} :1.65 μ m蛍光と Er^{3+} :1.5 4μ m蛍光の蛍光寿命を示した図である。

【符号の説明】

(7)

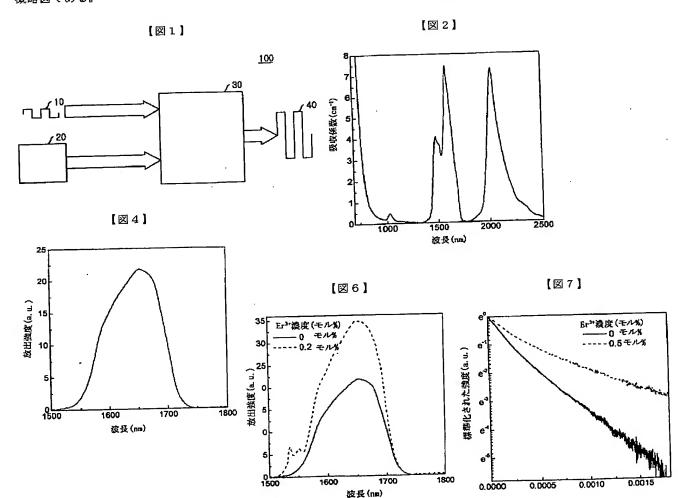
10 入力光信号

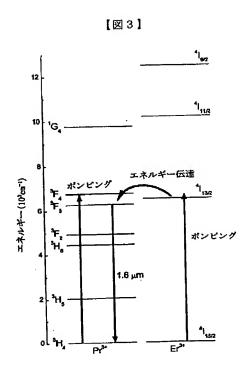
20 励起ソース

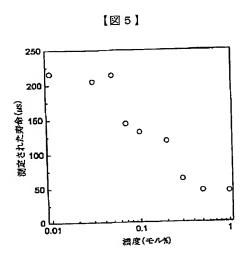
40 増幅された光信号

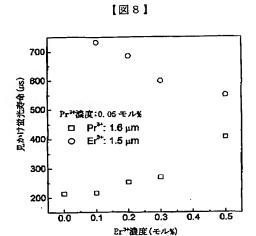
30 低ホノンエネルギーガラス

100 光增幅器









フロントページの続き

(72)発明者 キム キョンフォン 大韓民国 デジョンシ ユショング オウ ンドン ハンピット アパートメント. 128-1201

Fターム(参考) 5F072 AB07 AB09 AB20 JJ20 PP07 PP10 .